

Влияние адсорбционных процессов на электрофизические свойства поверхностных слоев диэлектрических материалов

Veimer, Vladimir; Roninson, Aleksander Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 57-67 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Влияние влажности на поверхностную и объемную проводимость некоторых диэлектриков

Bender, Villem; Roninson, Aleksander; Silas, Arne Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 79-88 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Импульсно-плазменное легирование кремния сурьмой

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 15-28 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Импульсно-плазменный отжиг слоев кремния, имплантированных бором

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 3-13 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Ионные процессы в каркасных алюмосиликатах

Denks, Viktor; Mere, Arvo; Ruus, Tõnu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 35-51 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Исследование углов смачивания некоторых диэлектрических материалов

Veimer, Vladimir; Bender, Villem; Kurik, Lembit; Udris, V. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 69-78 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Определение концентрационного профиля с помощью двух выпрямляющих контактов

Mankin, Romi; Paat, Aadu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 29-33 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Установка для измерения диэлектрических потерь порошковых материалов в широком интервале температур (80-600 К) и в условиях высокого вакуума

Mere, Arvo Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 53-56 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов

1983 https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>